

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

61169-1

QC 220000

1992

AMENDEMENT 2  
AMENDMENT 2

1997-04

---

---

Amendement 2

**Connecteurs pour fréquences radioélectriques –**

**Partie 1:**

**Spécification générique –**

**Prescriptions générales et méthodes de mesure**

Amendment 2

**Radio-frequency connectors –**

**Part 1:**

**Generic specification –**

**General requirements and measuring methods**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland

Telefax: +41 22 919 0300

e-mail: inmail@iec.ch

IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

E

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 46D: Connecteurs pour fréquences radioélectriques, du comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs et accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
46D/279/FDIS	46D/296/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 150

Ajouter, après le paragraphe 10.3.2.3, le nouveau paragraphe suivant:

10.3.3 Programme d'essai et exigences de contrôle pour la procédure du prélèvement fixe

**Tableau 1 – Procédure lot par lot – Essais d'acceptation: groupes A1 et B1**

	Méthode d'essai de la CEI 61169-1 QC 220000 Paragraphe	Niveau d'assurance M (haut)				Niveau d'assurance H (bas)			
		Test requis	NC	NQA %	Périodicité	Test requis	NC	NQA %	Périodicité
<i>Groupe A1</i>									
Examen visuel	9.1.2	a	11	1,0		a	S3	1,5	
<i>Groupe B1</i>									
Dimensions extérieures	9.1.3.1	a	S4	0,40		a	S3	0,40	
Compatibilité mécanique	9.1.3.3	a	11	1,0		a	S3	1,5	
Accouplement et désaccouplement	9.3.6	a	S4	0,40		a	S3	1,5	
Rétention du calibre (contacts élastiques)	9.3.4	ia	11	1,0	Lot	ia	S3	1,5	Lot
Étanchéité sans herméticité	9.4.5.1	ia	11	0,65	par	ia	S3	1,0	par
Étanchéité avec herméticité	9.4.5.2	ia	11	0,015		ia	S3	0,025	
Tension de tenue	9.2.6	a	S4	0,40	lot	a	11	4,0	lot
Soudabilité pièces détachées <sup>d)</sup>	9.3.2.1.1	ia	S4	0,40		ia	S3	4,0	
Résistance d'isolement	9.2.5	a	S4	0,40		a	S3	4,0	
Efficacité du fil des trous de sécurité	TBD	ia	S4	0,40		ia	S3	4,0	
a applicable ia test requis (si techniquement applicable) NC niveau de contrôle NQA niveau de qualité acceptable d) essais destructifs. Les spécimens ne doivent pas être remis en stock.									

## FOREWORD

This amendment has been prepared by the subcommittee 46D: RF connectors, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, RF connectors, and accessories for communication and signalling.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
46D/279/FDIS	46D/296/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 151

Add, after subclause 10.3.2.3, the following new subclause

10.3.3 Test schedules and inspection requirements for alternative fixed-quantity sample procedures

**Table 1 – Lot-by-lot procedure – Acceptance tests: groups A1 and B1**

	Test method of IEC 61169-1 QC 220000 Subclause	Assessment level M (higher)				Assessment level H (lower)			
		Test required	IL	AQL %	Period	Test required	IL	AQL %	Period
<i>Group A1</i>									
Visual inspection	9.1.2	a	11	1,0		a	S3	1,5	
<i>Group B1</i>									
Outline dimensions	9.1.3.1	a	S4	0,40		a	S3	0,40	
Mechanical compatibility	9.1.3.3	a	11	1,0		a	S3	1,5	
Engagement and separation	9.3.6	a	S4	0,40	Lot	a	S3	1,5	Lot
Gauge retention force (resilient contacts)	9.3.4	ia	11	1,0		ia	S3	1,5	
Scaling, non-hermetic	9.4.5.1	ia	11	0,65	by	ia	S3	1,0	by
Scaling, hermetic	9.4.5.2	ia	11	0,015	lot	ia	S3	0,025	lot
Voltage proof	9.2.6	a	S4	0,40		a	11	4,0	
Solderability piece-parts <sup>d)</sup>	9.3.2.1.1	ia	S4	0,40		ia	S3	4,0	
Insulation resistance	9.2.5	a	S4	0,40		a	S3	4,0	
Effectiveness of safety wire locking holes; piece-parts <sup>d)</sup>	TBD	ia	S4	0,40		ia	S3	4,0	
a applicable ia test required (if technically applicable) IL inspection level AQL acceptable quality level d) destructive tests – specimens shall not be returned to stock.									

**Tableau 2 – Procédure de prélèvement fixe – Séquence initiale d’essais groupe 0**

*Groupe 0*

Examen visuel  
 Dimensions extérieures  
 Compatibilité mécanique  
 Accouplement et désaccouplement  
 Rétention du calibre  
 (contacts élastiques)  
 Etanchéité sans herméticité  
 Etanchéité avec herméticité  
 Tension de tenue  
 Soudabilité pièces détachées<sup>d)</sup>  
 Résistance d’isolement

Méthode d'essai de la CEI 61169-1 QC 220000 Paragraphe	Niveau d'assurance M (haut)		Niveau d'assurance H (bas)	
	Test requis	Nombre d'échantillons	Test requis	Nombre d'échantillons
9.1.2	a	36 minimum	a	18 minimum
9.1.3.1	a			
9.1.3.3	a			
9.3.6	a			
9.3.4	ia			
9.4.5.1	ia			
9.4.5.2	ia			
9.2.6	a			
9.3.2.1.1	ia			
9.2.5	a			
a applicable ia test requis (si techniquement applicable) d) essais destructifs. Les spécimens ne doivent pas être remis en stock				

iTech Standards  
 (https://standards.itih.ai)  
 Document Preview

IEC 61169-1:1992/AMD2:1997

https://standards.itih.ai/catalog/standards/iec/61169-1-1992-amd2-1997

WILSON

**Table 2 – Fixed quantity sample procedure – Initial QA test sequence: group 0**

	Test method of IEC 61169-1 QC 220000 Subclause	Assessment level M (higher)		Assessment level H (lower)	
		Test required	Number of specimens	Test required	Number of specimens
<i>Group 0</i>					
Visual inspection	9.1.2	a	36 minimum	a	18 minimum
Outline dimensions	9.1.3.1	a			
Mechanical compatibility	9.1.3.3	a			
Engagement and separation	9.3.6	a			
Gauge retention force	9.3.4	ia			
(resilient contacts)					
Scaling, non-hermetic	9.4.5.1	ia			
Scaling, hermetic	9.4.5.2	ia			
Voltage proof	9.2.6	a			
Solderability piece-parts <sup>d)</sup>	9.3.2.1.1	ia			
Insulation resistance	9.2.5	a			
		a applicable			
		ia test required (if technically applicable)			
		d) destructive tests – specimens shall not be returned to stock			

iTech Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

IEC 61169-1:1992/AMD2:1997

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/61169-1-1992-amd2-1997>

**Tableau 3 – Procédure de prélèvement fixe – Groupes d’essais restant pour homologation  
Procédure lot par lot – Essais périodiques du groupe D**

	Méthode d’essai de la CEI 61169-1 QC 220000 Paragraphe	Niveau d’assurance M (haut)				Niveau d’assurance H (bas)			
		Test requis	Nombre d’échantillons	Nombre de défauts tolérés par groupe	Périodicité	Test requis	Nombre d’échantillons	Nombre de défauts tolérés par groupe	Périodicité
<i>Groupe D1 d)</i>									
Assemblage connecteurs par soudure	9.3.2.1.1	ia				ia			
Résistance à la chaleur de soudage	9.3.2.1.2	ia				ia			
Essais mécaniques sur la fixation du câble									
i) rotation du câble (nutation)	9.3.7.2	ia	6	0	3 ans	ia	3	0	3 ans
ii) traction du câble	9.3.8	ia							
iii) flexion du câble	9.3.9	ia							
iv) torsion du câble	9.3.10	ia							
Moment de flexion	9.3.12	a				a			
Tenue du mécanisme de verrouillage	9.3.11	ia				ia			
<i>Groupe D2 d)</i>									
Résistance de contact, continuité du conducteur extérieur et du blindage, continuité du conducteur central	9.2.3	a	6	0	3 ans	a	3	0	3 ans
Secousses	9.3.13	a <sup>3)</sup>							
Vibrations	9.3.3	a							
Chocs	9.3.14	a							
Chaleur humide, essai continu	9.4.3	a				a			
Brouillard salin	9.4.6	a							
<i>Groupe D3</i>									
Dimensions, pièces détachées et matériaux	9.1.3.2	a	1)	0	3 ans	a	1)	0	3 ans
<i>Groupe D4 d)</i>									
Endurance mécanique	9.5	a	6	0	3 ans	a	3	0	3 ans
Endurance à haute température	9.6	a							
Anhydride sulfureux	9.4.8	a <sup>3)</sup>							
<i>Groupe D5 d)</i>									
Facteur de réflexion	9.2.1	ia	6	0	3 ans	ia	3	0	3 ans
Efficacité d’écran	9.2.8	ia							
Immersion dans l’eau	9.2.7	a <sup>3)</sup>							
<i>Groupe D6 d)</i>									
Rétention du contact central	9.3.5	ia							
Essai de décharge (effet de couronne)	9.2.9	a	6	0	3 ans		3	0	3 ans
Variation rapide de température	9.4.4	a				a			
Séquence climatique	9.4.2	a				a			
<i>Groupe D7 d)</i>									
Résistance aux solvants et aux fluides polluants	9.7	a <sup>3)</sup>	1 <sup>2)</sup>	0	3 ans		1 <sup>2)</sup>	0	3 ans
a applicable ia test requis (si techniquement applicable) NC niveau de contrôle NQA niveau de qualité acceptable d) essais destructifs. Les spécimens ne doivent pas être remis en stock.									
NOTES 1) Un lot de pièces détachées de chaque type ou variante, sauf si on utilise des pièces identiques. 2) Nombre de paires pour chaque solvant. 3) Voir spécification particulière.									